# 穿孔法による残留応力測定について(その2)

三上 隆男<sup>\*1</sup> 松田 昌悟<sup>\*2</sup> Mikami Takao Matsuda Masanori

前回は、ASTM E837-08 規格とその他の穿孔法関連の文献を参照して、均一応力場における穿孔法の基礎 理論と穿孔装置の概要について解説した<sup>(1)</sup>。今回は、同規格で規定する不均一応力場の取り扱いと IIC が導 入した精密穿孔装置(ICHD) について解説する。

キーワード:残留応力測定、穿孔法、ICHD、ひずみ解放、ロゼットひずみゲージ、穿孔装置

#### 1. はじめに

穿孔法は、世界で最も広く使用されている残留 応力測定技術の一つである。測定手順は簡単に 要約すると以下の6つの基本ステップから成る。 (図1、図2参照)

- ・特殊な3要素ロゼットひずみゲージを測定対 象部品上の測定対象位置に貼り付ける。
- ロゼットひずみゲージからの配線を静ひずみ
   計に接続する。
- ・穿孔装置を測定対象部品上に設置し、そのドリル位置をロゼットひずみゲージの中心に合わせる。



図1 穿孔法

ゲージ回路のゼロバランス後、ドリルを用いて小径の浅い穴(例: ø2.0mm×深さ2.0mm)
 をロゼットひずみゲージの幾何中心を通るように穿孔する。



図2 ロゼットひずみゲージの接着<sup>(2)</sup>

\*1:技師長 博士 (工学)、技術士 (機械部門)、環境計量士 (騒音・振動関係)、一般計量士、JSNDI ひずみ測定・レベル3 \*2:計測事業部 計測技術部 部長

- ・ 穿孔により解放されるひずみを測定する。
- ・ 測定されたひずみから残留応力とその方向を 解析する。

これらの手順は比較的容易であり、ASTM 規格 E837-08<sup>(2)</sup>に規定されている。この試験法は面内応力 勾配が小さい場所での残留応力分布測定に適用で き、応力が深さ方向にほぼ一定("均一"応力)を保っ ているか(図3(a)参照)、または深さ方向にかなり の変化がある("不均一"応力)場合(図3(b)参照) を対象としている。また、測定対象物は、穿孔径に 比べて十分小さい厚さを有する"薄肉"または穿孔 径に比べてかなり大きい厚さを有する"厚肉"とし ている。薄肉の測定対象物に対しては均一応力の測 定のみを規定し、厚肉の測定対象物に対しては均一

本報では、ASTM 規格における不均一応力場の 取り扱いと IIC が導入した精密穿孔装置(ICHD) について解説する。



図3 測定対象位置に作用する残留応力<sup>(2)</sup>

#### 2. 測定方法

ASTM E837-08 では深さ方向に不均一な残留応 力分布を有する測定対象物に対し、図4に示す Type A または Type B のロゼットひずみゲージを 用いる場合は、20 段階の等しい穿孔ステップで小 刻みに穿孔し、ステップ毎に解放されるひずみを 測定するよう規定している。



図4 穿孔測定用ロゼットひずみゲージ<sup>(2)</sup>

同規格で規定している最大測定穴深さは 1.0mm であることから、穿孔ステップは 0.05mm (=1.0/20) とする必要がある。この 0.05mm の穿孔ステップを 実現するために、穿孔装置は穴の深さを ±0.004D (D はひずみゲージ円直径) 以内で制御できるもので あることを規定している。具体的には、通常よく 使用するゲージは D= Ø 5.14mm なので、±約 0.02mm 以内の精度で深さ制御できればよいことになるが、 0.05mm の要求深さステップに対して 0.02mm の精 度では足りない。実際にはミクロン(0.001mm)オー ダーで深さ制御できることが望ましい。

## 3. 残留応力計算法

穴の位置に元々存在していた残留応力は、穿孔 によって解放されたひずみから線形弾性論に基づく 数学的関係を用いて評価する。解放ひずみは穴内 部の材料に元々存在していた残留応力に依存する。

不均一応力の場合は、穿孔ステップ*j*完了後に 測定される表面ひずみの解放は、全ての穿孔ス テップ1≤*k≤j*において元々材料内に存在していた 残留応力に依存し、次式で表すことができる。

$$\varepsilon_{j} = \frac{1+\nu}{E} \sum_{k=1}^{j} \overline{a}_{jk} \left( \left( \sigma_{x} + \sigma_{y} \right) / 2 \right)_{k}$$
$$+ \frac{1}{E} \sum_{k=1}^{j} \overline{b}_{jk} \left( \left( \sigma_{x} + \sigma_{y} \right) / 2 \right)_{k} \cos 2\theta$$
$$+ \frac{1}{E} \sum_{k=1}^{j} \overline{b}_{jk} \left( \tau_{xy} \right)_{k} \sin 2\theta \tag{1}$$

ただし、

- $\bar{a}_{it}$  = 等方応力に対する校正マトリックス  $\overline{b}_{ik}$ = せん断応力に対する校正マトリックス = ヤング率 Ε = これまでの穿孔ステップ数(通し番号) i k = 穿孔ステップの順番 ε<sub>i</sub> = i 穿孔ステップが実行された後に測定さ れた解放ひずみ v = ポアソン比 $\theta = x 軸からのひずみゲージ角度$  $(\sigma_x)_k = 穿孔ステップ k 内の x 方向垂直応力$  $(\sigma_y)_k = 穿孔ステップ k 内の y 方向垂直応力$  $(\tau_{xy})_{\mu} = 穿孔ステップ k 内の xy せん断応力$ 穿孔過程中、最初の穿孔ステップによる材料の除 去は、そのステップ内の穴境界で解放される残留応 力に直接関係する表面ひずみ解放(ゲージ位置で) を生じさせる結果となる。2番目のステップによる
- 材料の除去は、二つの効果を生じる。最初に、構造 剛性が変化するため、最初のステップに対応する材 料層内で付加的な応力解放があり、それに対応して ゲージ部で付加的なひずみ変化が生じる。次に、2

番目のステップの穴境界で解放したひずみにより、 ゲージ部で付加的なひずみ変化が生じる。このよう に、たとえ2番目の穿孔ステップが残留応力を含ん でいなくても、最初の穿孔ステップに対応する材料 層内での付加的な応力解放があるため2番目のス テップでゲージ部に付加的なひずみ変化が生じる。

したがって、各々の応力深さと穴深さの組合せ に対して、表面ひずみ変化と残留応力とを関係づ けるために異なる校正マトリクス $\overline{a}_{\mu} \ge \overline{b}_{\mu}$ が必要と なる。

校正マトリクス $\bar{a}_{jk} \geq \bar{b}_{jk}$ は、穿孔ステップk内の 単位応力に起因するj穿孔ステップにおける解放 ひずみを示す。図5は、穴を合計20ステップで 深さ1mm (0.05mm×20) まで穿孔する場合にお いて、4ステップ (0.05mm×4=0.2mm) まで進行 した状態の穿孔断面を示す。

この図の物理的な意味を解説すると以下のようになる。

- ステップ1では、ā<sub>11</sub>のみが解放ひずみに影響する。
- ステップ2では、*ā*<sub>22</sub>だけでなく、穴の深さの増加によりステップ1で穿孔した部分の剛性が変化し、これに起因する解放ひずみ(これを*ā*<sub>21</sub>と表現する)が重畳するので、結局、ステップ2で測定される全解放ひずみは*ā*<sub>22</sub>と*ā*<sub>21</sub>の影響を受ける。
- ステップ3では、同様に、ā<sub>33</sub>だけでなく、穴の深さの増加によりステップ1およびステップ2で穿孔した部分の剛性が変化し、これらに起因する解放ひずみ(それぞれā<sub>31</sub>、ā<sub>32</sub>と表現する)が重畳するので、結局、ステップ3で測定される全解放ひずみはā<sub>33</sub>、ā<sub>31</sub>、ā<sub>32</sub>の影響を受ける。
- ステップ4では、同様に、ā<sub>44</sub>だけでなく、穴の深さの増加によりステップ1~ステップ3
   で穿孔した部分の剛性が変化し、これらに



図5 校正マトリクス<sup>*ā*</sup><sub>*jk*</sub>の説明

起因する解放ひずみ(それぞれ $\bar{a}_{41}$ 、 $\bar{a}_{42}$ 、 $\bar{a}_{43}$ と表現する)が重畳するので、結局、ステップ4 で測定される全解放ひずみは $\bar{a}_{44}$ 、 $\bar{a}_{41}$ 、 $\bar{a}_{42}$ 、  $\bar{a}_{43}$ の影響を受ける。

ステップ5以降も同様である。

校正マトリクスの値は標準ロゼットパターンに 対しては有限要素法(FEM)計算<sup>(5)</sup>によって決定 されており、ASTM E837-08 規格にそれらの値が 一覧表形式で表示されている。

## 4. 不均一応力の計算手順

## 4.1 ひずみデータ:

穴深さに対する測定ひずみ $\varepsilon_1$ 、 $\varepsilon_2$ 、 $\varepsilon_3$ をグラフ にプロットし、データが全体的に滑らかな傾向で あることを確認する。本質的に不規則な値や明確 に大きくはずれた値が存在しないかどうかを調べ る。必要な場合は穿孔試験を繰り返す。

測定されたひずみ $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ の各組に対して以下の組合せひずみベクトルを計算する。

$$p_{i} = \left(\varepsilon_{3} + \varepsilon_{1}\right)_{i} / 2 \tag{2}$$

$$q_{i} = \left(\varepsilon_{3} - \varepsilon_{1}\right)_{i} / 2 \tag{3}$$

$$t_{j} = \left(\varepsilon_{3} + \varepsilon_{1} - 2\varepsilon_{2}\right)_{j} / 2 \tag{4}$$

ここで、下付き文字 j は連続する測定ひずみ  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 、  $\varepsilon_3$ の組に対応する穿孔ステップの通し番号を表す。 次に、組合せひずみ内の標準誤差を見積る。

$$p_{std}^{2} = \sum_{j=1}^{n-3} \frac{\left(p_{j} - 3p_{j+1} + 3p_{j+2} - p_{j+3}\right)^{2}}{20(n-3)}$$
(5)

$$q_{std}^{2} = \sum_{j=1}^{n-3} \frac{\left(q_{j} - 3q_{j+1} + 3q_{j+2} - q_{j+3}\right)^{2}}{20(n-3)}$$
(6)

$$t_{std}^{2} = \sum_{j=1}^{n-3} \frac{\left(t_{j} - 3t_{j+1} + 3t_{j+2} - t_{j+3}\right)^{2}}{20(n-3)}$$
(7)

ここで、*n*=さまざまな穿孔ステップにおけるひ ずみデータの組番号。加算は 1≤*j*≤*n*-3 の範囲で実 行する。

### 4.2 校正マトリクス:

A型ロゼットを使用する場合は、ASTM E837-08 規格の Table 5 で与えられる校正データを使用して マトリクス $\bar{a}_{\mu}$ と $\bar{b}_{\mu}$ を形成する。Table 5 の数字は最 も一般的に使用されている  $\phi$ 5.14mm 公称サイズ のロゼットについて示している。 $\phi$ 2.57mm ロゼッ トを使用する場合は、Table 5 中の全ての穴と応力 深さに 0.5 を乗じる。 $\phi$ 10.28mm ロゼットを使用す る場合は、全ての穴と応力深さに 2 を乗じる。 B型ロゼットを使用する場合は、Table 6 で与え られる校正データを使用してマトリクス $\bar{a}_{\mu}$ と $\bar{b}_{\mu}$ を 形成する。C型ロゼットを使用する場合は、代わ りに Table 7 を使用する。B および C型ロゼット は  $\phi$ 5.14mm 公称サイズのみが一般に利用できる。

Table 5-7 内の一覧表の数字は穴径 2mm に対応する。測定穴径に一致させるために、数字に (測定穴径 /2mm)<sup>2</sup> を乗じて調整する必要がある。

#### 4.3 応力計算法:

各穿孔ステップ内の残留応力は積分法<sup>(5)</sup>(Integral method)を用いて下記のように対応する測定ひずみのマトリクス方程式を解くことによって計算できる。

$\bar{\mathbf{a}}\mathbf{P} = \frac{E}{1+\nu}\mathbf{P}$	(8)
--	-----

 $\overline{\mathbf{b}}\mathbf{Q} = E\mathbf{q}$  (9)

 $\overline{\mathbf{b}}\mathbf{T} = E\mathbf{t}$  (10)

この中で、

$$P_{k} = \left( \left( \sigma_{y} \right)_{k} + \left( \sigma_{x} \right)_{k} \right) / 2$$

$$Q_{k} = \left( \left( \sigma_{y} \right)_{k} - \left( \sigma_{x} \right)_{k} \right) / 2$$
(11)
(12)

$$T_k = \left(\tau_{xy}\right)_k \tag{13}$$

また、組合せひずみ **p、q、t** は式(2)-(4) に定 義されている。

式(8)は4ステップ穿孔の場合、次式のようになる。

$$\begin{bmatrix} \overline{a}_{11} & & \\ \overline{a}_{21} & \overline{a}_{22} & \\ \overline{a}_{31} & \overline{a}_{32} & \overline{a}_{33} & \\ \overline{a}_{41} & \overline{a}_{42} & \overline{a}_{43} & \overline{a}_{44} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix} = \frac{E}{1+\nu} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \end{bmatrix}$$
(14)

このマトリクス方程式(14)を展開すると次の ようになる。

$$P_{1} = \left[ p_{1}E / (1+v) \right] / \bar{a}_{11},$$

$$P_{2} = \left[ p_{2}E / (1+v) - (p_{1}\bar{a}_{21}) \right] / \bar{a}_{22},$$

$$P_{3} = \left[ p_{3}E / (1+v) - (p_{2}\bar{a}_{32}) - (p_{1}\bar{a}_{31}) \right] / \bar{a}_{33},$$

$$P_{4} = \left[ p_{4}E / (1+v) - (p_{3}\bar{a}_{43}) - (p_{2}\bar{a}_{42}) - (p_{1}\bar{a}_{41}) \right] / \bar{a}_{44}$$
実際には前述のように20ステップで穿孔する

ので、P<sub>20</sub>まで計算が必要である。

組合せ応力**Q、T**は同様に計算される(ただし、 ポアソン比の項は除く)。

積分法の主な利点と制限は以下のとおりである。

- ・積分法は非常に不均一な残留応力分布を解析 することが可能である。例えば、ショットピー ニングされた部品表面近くの残留応力分布を 測定できる。
- ・上記に示す関係式はP<sub>n+1</sub>の計算に応力項P<sub>n</sub> を使用していることを示す。このように、連 続する穿孔ステップでの計算が連成している ので、ひずみ測定と穿孔深さ誤差の重畳など の原因で、ステップn内での応力が過大見積 もりされると、ステップ(n+1)内ではそれに 対応して過小見積もりをもたらす効果を生じ る。結果として、ステップ(n+2)内の応力へ の影響は非常に小さいものとなる。

式(8)-(10)による応力計算は、用いられる穴深 さステップ数が少ないときに有効である。しかし、 上述のように、大きな数の穿孔ステップに対して は、測定ひずみの小さな誤差が計算応力に比較的 大きな誤差を生じさせる。この効果を減少させる ため、規格では Tikhonov 正規化<sup>(7)-(9)</sup>によるデータ のスムージング法を規定している。スムージング 後のデータが式(5)-(7)で計算される標準誤差の 5%以内になるまで、繰返し計算を行う。

このスムージング計算により最終的に得られた **P、Q、T**を用いて、カーテシアン応力を次のよう に算出する。

$$\left(\sigma_{x}\right)_{j} = P_{j} - Q_{j} \tag{15}$$

$$\left(\sigma_{y}\right)_{i} = P_{j} + Q_{j} \tag{16}$$

$$\left(\tau_{xy}\right)_{i} = T_{j} \tag{17}$$

主応力とその方向を次のように算出する。

$$\left(\boldsymbol{\sigma}_{\max}\right)_{k}, \left(\boldsymbol{\sigma}_{\min}\right)_{k} = P_{k} \pm \sqrt{Q_{k}^{2} + T_{k}^{2}}$$
(18)

$$\beta_k = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{-T_k}{-Q_k}\right) \tag{19}$$

なお、主応力角度 β<sub>k</sub>の位置判定は**表1**による。

— 43 —

表 1 主応力角度 β の位置判定<sup>(2)</sup>

	Q > 0	Q = 0	Q < 0
T < 0	45° < β < 90°	45°	0° < β < 45°
T = 0	90°	undefined	0°
T > 0	-90° < β < -45°	45°	–45° < β < 0°

#### 5. 精密穿孔装置 (ICHD) について

深さ方向に不均一な残留応力分布を測定するためには、上述のように 0.05mm ステップで精密に
 穿孔できる装置が必要である。IIC はイタリアの
 S 社から精密穿孔装置を導入した(図6参照)。この装置は Incremental Center Hole Drilling (ICHD)
 装置と呼ばれ、穿孔ドリルは約 400,000rpm の高

速エアタービンで駆動される。ステッピ ングモーター制御により、任意に設定し た条件(穿孔ステップ数と深さ増分)で 1µmの深さ分解能で自動的に穿孔する。 解放されるひずみは穿孔ステップ毎に ディジタル静ひずみ計により自動的に測 定し、試験後にASTM E837-08 対応の専



図6 精密穿孔装置(ICHD)

用のソフトウエアを用いて残留応力を解析する。 この専用ソフトウエアには Kochelmann による解 析法<sup>(10)</sup>も取り入れられている。

穿孔システム全体の写真を図7に示す。

本システムにより、ある鋼材を測定した結果の 一例を図8に示す。この例では、深さ方向の応力 分布が均一か不均一かを判定するため、¢2mmで 深さ2mm(0.05mm×40ステップ)まで穿孔した。



図7 穿孔システム全体



応力は $\sigma_{max}$ 、 $\sigma_{min}$ 、 $\sigma_{mises}$ で表示している。図から 明らかなように、応力分布は不均一であり、表面 から深さ 1mmの範囲で残留応力が複雑に分布し ていることがわかる。 $\sigma_{max}$ は約 230MPa である。

# 6. おわりに

ASTM 規格 E837-08 で規定されている「穿孔ひ ずみゲージ法による残留応力測定のための標準試 験法」について、今回は深さ方向に不均一な応力 場を対象として、測定方法と計算方法ならびに精 密穿孔装置(ICHD)の概要について解説した。

#### 参考文献

- 三上 隆男 "穿孔法による残留応力測定法に ついて(その1)" IIC REVIEW No.48、2012/10
- (2) ASTM E 837-08, "Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the Hole-Drilling Strain-Gauge Method", 2008
- (3) Technical Note TN-503-6, "Measurement of Residual Stresses by the Hole Drilling Strain Gauge Method", Vishay Measurement Group, 2010
- (4) P V Grant, J D Lord, P S Whitehead, "The Measurement of Residual Stresses by the Incremental Hole Drilling Technique", Measurement Good Practice Guide No.53, National Physical Laboratory, 2002

- (5) Schajer, G. S., "Measurement of Non-Uniform Residual Stresses Using the Hole Drilling Method", Journal of Engineering Materials and Technology, Vol.110, No.4: Part I, pp.338-343; Part II, pp.344-349, 1988
- (6) Schajer, G. S., "Application of Finite Element Calculations to Residual Stress Measurements", Journal of Engineering Materials and Technology, Vol.101: pp.157-163, 1981
- (7) Schajer, G. S., "Hole-Drilling Residual Stress Profiling with Automated Smoothing", Journal of Engineering Materials and Technology, Vol.129, No.3, pp.440-445, 2007
- (8) Tikhnov, A., Goncharsky, A., Stepanov, V., and Yagola, "Numerical Methods for the Solution of Ⅲ-posed Problems", Kluwer, Dordrecht, 1995
- (9) Tjhung, T., and Li, K. "Measurement of Inplane Residual Stresses Varying with Depth by the Interferometric Strain/Slope Rosette and Incremental Hole-Drilling", Journal of Engineering Materials and Technology, Vol.125, No.2, pp.153-162, 2003
- (10) Schwartz, T., Kochelmann, H., "The Hole Drilling Method-The Best Technique for the Experimental Determination of Residual Stresses in Many Fields of Application", Messtechnische Briefe 29, No.2, pp.33-38, 1993



技師長 博士 (工学)、技術士 (機械部門)、環境計量士 (騒音・ 振動関係)、一般計量士、JSNDI ひずみ測定・レベル3 三上隆男 TEL. 03-3778-7965 FAX. 03-3778-7968



計測事業部 計測技術部 部長 松田 昌悟 TEL. 045-791-3518 FAX. 045-791-3542